

四、结 语

我们已经介绍了实时监控对 $1.3\mu\text{m}$ LD沉积AR的新方法,它表明了该技术可以在SLC镀膜AR膜过程的任何时间内监测剩余反射率的变化,已经测量了反射率,并已获得了低于 5×10^{-4} 的超低反射率。我们已经将本技术成功地应用于制备优质的行波半导体激光放大器(TW-SLA)。

参 考 文 献

- [1] Mukai T, Yamamoto Y. Optical direct amplification for fibre transmission. Rev Elect Commun Lab, 1983; 3 (3) : 340~348
- [2] Simon J C. Semiconductor laser amplifier for single-mode optical fibre communication, J Opt Commun, 1983; 4 (2) : 51~56
- [3] O'Mahony M J, Marshall I W. An optical repeater using a semiconductor laser amplifier. 3rd Int Conference on Telecommunication Transmission. London; 1985; 159~161
- [4] Weatlake H J, Adams M J, O'Mahony M J. Optical bistability measurements on a $1.5\mu\text{m}$ semiconductor laser amplifier. CLEO'85, Baltimore; 1985
- [5] Kressel H, Butler J K. Semiconductor lasers and heterojunction LEDs, 1977
- [6] Kaminow I P, Eisenstein G, Stulz L W. Measurements of the model reflectivity of an antireflection coating on a super-luminescent diode. IEEE J Q E, 1983; QE-19; 493
- [7] 黄德修. 半导体光电子学. 成都: 电子科技大学出版社, 1989

收稿日期: 1991年8月13日。

· 简 讯 ·

西物所硅雪崩光电二极管及前放组件通过生产鉴定

中国兵器工业总公司于1992年1月8~12日在成都主持了对西南技术物理研究所SPD-032硅雪崩光电二极管及SPD-052雪崩光电二极管前放组件($\lambda = 400 \sim 1100\text{nm}$)产品的生产鉴定会。有关专家及部分使用厂家代表参加了生产鉴定会。与会代表对该产品的工艺及技术资料、产品性能,对生产线的生产、检测设备,对质量保证体系等进行了全面认真的审查。全体代表一致认为,1985年曾获国家技术进步一等奖的该项成果,近几年经过多次工艺改进,提高了成品率,使产品性能更加稳定可靠,通过扩充生产及检测设备,现已具备批量生产能力,提供实用的合格产品,从而结束了我国高灵敏光电探测元件一直依赖进口的历史。

(郝正福 供稿)